Документ полтисан простой алектронной полтиской и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное государственное автономное образовательное учреждение** Дата подписания: 31.07.2023 14:21:05 **высшего образования** 

Уникальный профрациональный исследовательский технологический университет «МИСИС»

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

# Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

# Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств

Закреплена за подразделением Кафедра ППЭ и ФПП

Направление подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144 Формы контроля в семестрах:

в том числе: зачет с оценкой 7

 аудиторные занятия
 51

 самостоятельная работа
 93

## Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
Недель	18			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	34	34	34	34
Практические	17	17	17	17
Итого ауд.	51	51	51	51
Контактная работа	51	51	51	51
Сам. работа	93	93	93	93
Итого	144	144	144	144

УП: 11.03.04-БЭН-22.plx стр.

# 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компенсаций в соответствие с учебным планом в области электроники и наноэлектроники, применительно к изучению физических, экспериментальных и технологических основ наноэлектроники, перспектив ее развития на основе фундаментальных физических закономерностей и явлений, а также фундаментальных квантовых ограничений, таких как интерференционные эффекты, процессы туннелирования

	2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ				
	Блок ОП: Б1.В.ДВ.06				
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:				
2.1.1	Материаловедение полупроводников и диэлектриков				
2.1.2	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности				
2.1.3	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности				
2.1.4	Технология материалов электронной техники				
2.1.5	Физика диэлектриков				
2.1.6	Физика конденсированного состояния				
2.1.7	Безопасность жизнедеятельности				
2.1.8	Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике				
2.1.9	Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике				
2.1.10	Статистическая физика				
2.1.11	Физические свойства кристаллов				
2.1.12	Электроника				
2.1.13	Математическая статистика и анализ данных				
2.1.14	Методы математической физики				
2.1.15	Практическая кристаллография				
2.1.16	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений				
2.1.17	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений				
2.1.18	Физика				
2.1.19	Физическая химия				
2.1.20	Электротехника				
2.1.21	Математика				
2.1.22	Органическая химия				
2.1.23	Информатика				
2.1.24	Химия				
2.1.25	Инженерная и компьютерная графика				
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:				
2.2.1	Вакуумная и плазменная электроника				
2.2.2	Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике				
2.2.3	Магнитные измерения				
2.2.4	Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики				
2.2.5	Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники				
2.2.6	Нормы и правила оформления ВКР				
2.2.7	Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики				
2.2.8	Основы радиационной стойкости изделий электронной техники				
2.2.9	Основы технологии электронной компонентной базы				
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				
2.2.11	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				
2.2.12	Приборы квантовой и оптической электроники				
2.2.13	Процессы вакуумной и плазменной электроники				
2.2.14	Светоизлучающие полупроводниковые приборы				
2.2.15	Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики				
2.2.16	Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом				
2.2.17	Элементы и устройства магнитоэлектроники				

УП: 11.03.04-БЭН-22.plx стр. 3

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

#### ПК-5: Способность разрабатывать технические описания на отдельные блоки изделий электронной техники

#### Знать:

ПК-5-31 принципы функционирования и характеристики наноэлектронных устройств на базе квантово-размерных структур

ПК-5-32 электронную компонентную базу производства изделий микро- и наноэлектроники

УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения

#### Знать:

УК-2-31 современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники

#### ПК-5: Способность разрабатывать технические описания на отдельные блоки изделий электронной техники

#### Уметь:

ПК-5-У1 разрабатывать технические описания на отдельные блоки изделий микро- и наноэлектроники

УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения

#### Уметь:

УК-2-У1 применять законы функционирования наноэлектронных устройств

#### ПК-5: Способность разрабатывать технические описания на отдельные блоки изделий электронной техники

#### Владеть:

ПК-5-В1 методами оценки ожидаемых результатов при внедрении конструктивных решений в наноэлектронные приборы и системы

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы, соответствующие профилю подготовки, разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

## Владеть:

ОПК-4-В1 навыками использования стандартных программных средств компьютерного моделирования